

Połyskomierz micro-TRI-gloss μ

pomiar połysku i grubości warstwy jednym urządzeniem

Sprawny proces nakładania powłoki powinien zużywać jak najmniejszą ilość farby oraz spełniać wymagania jakościowe klienta.

Połysk i grubość warstwy stanowią ważne kryteria kontrolne dla powłok.

Micro-TRI-gloss μ mierzy oba parametry jednocześnie - w tym samym obszarze próbki:

- równoczesne wskazania 20°, 60°, 85° dla powłok o różnym stopniu połysku,
- podwójny czujnik Fe/NFe – mierzy grubość powłoki zarówno na stali jak i na np. aluminium.

Normy

	Polysk	Grubość
ISO	2813, 7668	2178, 2360, 2808
ASTM	D 523	B 499, D 1400
DIN	67530	

Urządzenie posiada opcję menu w języku polskim



Informacje handlowe

Specyfikacja techniczna

Nr. kat.	Opis	Geometria	Aplikacja	Obszar pomiarowy
4560	micro-gloss 20°	20°	wysoki połysk	10 x 10mm
4561	micro-gloss 60°	60°	średni połysk	9 x 15mm
4562	micro-gloss 85°	85°	mat	5 x 38mm
4563	micro-TRI-gloss	20°, 60°, 85°	uniwersalna	zobacz odpowiedni kąt
4564	micro-TRI-gloss μ	20°, 60°, 85°	uniwersalna	zobacz odpowiedni kąt
4565	micro-gloss 60° S	60°	średni połysk	9 x 15mm
4566	micro-TRI-gloss S	20°, 60°, 85°	uniwersalna	zobacz odpowiedni kąt
4567	micro-gloss- 45°	45°	ceramika, plastik	9 x 13mm
4568	micro-gloss 75°	75°	papier, tektura	7 x 24mm
4569	micro-gloss 60° XS	60°	średni połysk	2 x 4mm
4570	micro-gloss 60° XS-S	60°	średni połysk	2 x 4mm

Zakres dostawy:

Przyrząd pomiarowy
Podstawa kalibracyjna ze standardem
Certyfikat
Przewód do komputera PC
Instrukcja obsługi, także w języku polskim
Bateria
Walizka
Oprogramowanie do pobrania: smart-lab Gloss
lub smart-process Gloss (2 licencje)

Uwagi: programy można używać jako 30 dniową wersję próbną. Po tym okresie użytkownik musi zdecydować i zarejestrować jeden z nich.

Wymagania systemowe:

System operacyjny 32-bit: Windows 7 SP1 lub 8.1
Procesor: Core 2 duo. 22GHz, rekomendowany i7
lub równoważny
Pamięć RAM: 4 GB, rekomendowane 8 GB
Wolna przestrzeń na dysku: min. 300 MB

Zakres pomiarowy	0 – 100 GU	100 – 2000 GU
Powtarzalność *1	± 0.2 GU	± 0.2 %
Odtwarzalność *2	± 0.5 GU	± 0.5 %
Czułość spektralna	standardowy obserwator CIE dla iluminatorów CIE-C	
Czas pomiaru	0.5 sekundy / geometrie	
Grubość		
Podłoże	Fe: magnetyczne NFe: niemagnetyczne	
Zakres pomiarowy	0 – 500 μ m	
Dokładność	$\pm (1.5 \mu\text{m} + 2\%$ wartości mierzonej)	
Pamięć	999 odczytów z datą i czasem	
Interface	USB	
Zasilanie	jedna bateria alkaliczna 1.5V AA, 4000 odczytów lub przez port USB	
Wymiary	155 x 73 x 48	
Waga	0.4 kg	
Temperatura pracy	15 – 40 °C	
Wilgotność względna	Do 85%, bez kondensacji	

*1 dla 45° i 75° zobacz oddzielną tabelkę

*2 dla serii S zobacz oddzielną tabelkę

Informacje handlowe

Akcesoria

Nr. kat.	Opis	
4405	Kabel USB	Transfer danych z polyskomierza do komputera PC
4866	Smart-lab Gloss	Program do profesjonalnej analizy i dokumentowania w laboratorium
4867	Smart-process Gloss	Oprogramowanie proces QC do analizy produktów o wielu różnych punktach pomiarowych
	Export / Import	Standardy (format .xml) Organizery (format .xml)
	Języki	Chiński, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Hiszpański